

用于晶圆的极向克尔效应测量系统 BH-810CPC25



产品描述:

用于磁性半导体的 8 英寸或 12 英寸晶圆目标映射测量的非接触式评估系统。

通用参数:

光源	二极管激光器 (408nm 或 650nm)
测量克尔效应	纵向克尔效应
激光光斑直径	φ2mm
磁场	面内方向: Max. >±2kOe (±0.2T)
晶圆尺寸	8 英寸或 12 英寸晶圆

测量示例:

